

BIOGRAPHY

Test Tutorial 2025



Interface/ DIB/ Socket/ Prober/ Handler
오창수 대표 / (주)일레븐랩스(반도체 테스트랩)

Abstract

반도체 검사 공정의 핵심 설비중의 하나인 TESTER 성능을 손실 없이 사용하기 위해서는 Test Socket, DIB(Device Interface Board), Probe Card 등의 interface 제품의 올바른 선택과 사용은 대단히 중요하며 특히 underkill일 때의 품질 issue 또는 overkill일 때의 양품 손실 등 품질과 비용측면에서 매우 큰 영향을 끼치는 핵심 구성품이라 할 수 있다.

기초적인 기능과 동작을 이해하고 사용자 입장에서의 올바른 제품의 선택을 위해 고려해야 할 사항들과 개발자 입장에서 설계와 개발 시 우선하여 관심을 가져야 할 부분을 살펴본다.

Biography

(1) 경력

(주)일레븐랩스 대표이사 사장

(주)티에스이 대표이사 사장

(주)티에스이 소켓/Probe Card & MEMS/시스템 사업부 사업부장

(주)티에스이 연구소장

(주)삼성전자 반도체 시스템LSI Test Handler설비 개발

고려대 경영정보대학원 경영학석사(MBA)

남서울대학교 전자공학과

(2) 관심 분야

Bare Die Test Handler for KGD/KGSD, Bare Die Test Socket, Burn-In Socket, Memory/SoC Probe Card, Memory/SOC DIB, Prober, Advanced Packaging such as TSV & FOWLP & HBM.